



计算机应用 » 2013, Vol. 33 » Issue (09): 2698-2700 DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2013.09.2698

[典型应用](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#)

基于改进Canny算子的LED晶片边缘检测

温阳东¹, 顾倩芸¹, 陈雪峰²

1. 合肥工业大学 电气与自动化工程学院, 合肥 230009
2. 合肥工业大学合肥工业大学 电气与自动化工程学院, 合肥 230009

LED wafer edge detection based on improved Canny operator

WEN Yangdong, GU Qianyun, CHEN Xuefeng

School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, Hefei Anhui 230009, China

[摘要](#) [图/表](#) [参考文献](#) [相关文章 \(15\)](#)

?

版权所有 ©2005 - 2009
 地址：四川成都237信箱 (武侯区)《计算机应用》编辑部(610041)
 电话：028-85224283-803
 E-mail: bjb@joca.cn

[服务条款](#) | [隐私声明](#)

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

蜀ICP备05010208号